



Narzędzie do kontroli jakości koloru

## X-Rite Ci™52

Uniwersalny spektrofotometr

Uniwersalne narzędzie do zgodnych pomiarów różnego rodzaju próbek w zakresie materiału, rozmiaru, kształtu, tekstury i stopnia nieprzezroczystości. Jednoczesny pomiar koloru i wyglądu zwiększa dokładność. Urządzenie może być używane, jako przenośne lub w połączeniu ze statywem, jako stacjonarne. Wbudowany system NetProfiler3 zapewnia stałość systemu i precyzję działania.



## X-Rite Ci52 Specyfikacja

Geometria pomiarowa	d/8°, technologia DRS SPIN / SPEX
Szczelina pomiarowa	8mm obszar pomiaru 14mm okno celownicze
Źródło światła	Lampa wolframowa napełniona gazem
Detektor	Fotodiody krzemowe z podwyższoną czułością w zakresie światła niebieskiego
Zakres spektralny	400 – 700nm
Interwał spektralny	10nm – pomiar 10nm – wyjście
Zakres pomiarowy	0 do 200% współczynnika odbicia
Czas pomiaru	Okolo 2 sekund
Zgodność między-urządzeniowa	CIE L*a*b*: Średnio 0.20 ΔE*ab w oparciu o średnią z pomiarów 12 płytek BCRA Serii II (SCI - z włączeniem połysku) Max. 0.40 ΔE*ab na jakiegokolwiek płytce (SCI - z włączeniem połysku)
Powtarzalność	.05 ΔE*ab na białej płytce ceramicznej
NetProfiler wsparcie	Wbudowane
Transform Wsparcie	Wbudowane
Żywotność lampy	Okolo 500 000 pomiarów
Zasilanie	Zasilacz 90 – 130VAC lub 100 – 240VAC, 50 – 60Hz, 15W max
Połączenie	USB
Zakres temperatur użytkowania	50° do 104°F (10° to 40°C) 85% względnej wilgotności (niekondensująca)
Zakres temperatur przechowywania	-4° do 122°F (-20° do 50°C)
Waga	1.9 lbs. (.87 kg)
Wymiary	4.3"H (10.9 cm) x 3.6"W (9.1 cm) x 8.4"L (21.3 cm)
Dołączone akcesoria	Wzorzec kalibracyjny: Czarna pułapka, wymienny biały i zielony standard, instrukcja obsługi, zasilacz, kabel USB
Opcjonalnie	Stacjonarny statyw

## Zalety X-Rite Ci52

Uniwersalność. Możliwe zastosowanie, jako przenośnego lub stacjonarnego rozwiązania; Zdalny przycisk pomiaru zapewnia wygodę.

Łatwy w użytkowaniu. Praca w trybie zbliż i dociśnij, wspomaganą wizualnie (LED) i dźwiękowo.

Ulepszony całkowity pomiar. Tłumiąca drgania i przełączana stopa celownicza oraz zdalny przycisk pomiaru ułatwia pomiar trudnych do ustawienia próbek.

Przystosowany do pomiarów różnego rodzaju próbek o różnych kształtach. Zdolność pomiaru 14 mm próbki lub większych materiałów tj. papier, tworzywa, tkaniny i inne powierzchnie.

Szybkie, odpowiednie odczyty. Czas pomiaru to 2 sekundy dla płaskich powierzchni jak i innych skomplikowanych kształtów.

Niezawodne osiągi. Jednoczesny pomiar z włączeniem połysku (kolor) jak i wyłączeniem połysku (wygląd), w celu zbadania wpływu komponentu połysku na próbkę.

Zgodne pomiary. Pierwszorzędna zgodność zapewnia integralność kontroli koloru wieloma urządzeniami.

Wbudowany NetProfiler®3. Wbudowany system optymalizuje osiągi urządzenia i pozwala na zdalną certyfikację.

Bezproblemowe przejście. Działa zgodnie z istniejącymi spektrofotometrami X-Rite.



### X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803-2100 • xrite.com

©2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved.

Wyłączny Przedstawiciel X-Rite w Polsce  
dla grupy produktów  
„Industrial Color and Appearance”



ul. Kopernika 2, 11-500 Giżycko

+48(87)428 21 68

xrite@kamado.pl

www.kamado.pl

